## 05

© Н.А. Толстых<sup>1</sup>, Е.В. Иевлева<sup>1</sup>, Л.Н. Коротков<sup>1</sup>, Ч. Ли<sup>2</sup>, А.А. Александров<sup>2</sup>, К.Г. Абдулвахидов<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия <sup>2</sup> Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия E-mail: I\_korotkov@mail.ru

Поступило в Редакцию 25 ноября 2024 г. В окончательной редакции 5 января 2025 г. Принято к публикации 22 января 2025 г.

Изучено влияние силового воздействия в сочетании со сдвиговой деформацией (СВСД) на диэлектрическую проницаемость ( $\varepsilon$ ) и магнитный отклик нанокристаллического титаната бария. Обнаружено заметное увеличение намагниченности насыщения BaTiO<sub>3</sub> в результате СВСД, что связывается с повышением в нем плотности дислокаций. Отжиг при температуре 1300 °C исходного и подвергшегося СВСД образцов приводит к существенному увеличению  $\varepsilon$ . Вместе с тем диэлектрическая проницаемость подвергшегося обработке образца ниже, чем для исходного, что указывает на более высокое содержание в нем дефектов решетки.

Ключевые слова: сдвиговые деформации, дефекты решетки, слабый магнетизм, диэлектрические свойства.

DOI: 10.61011/PJTF.2025.09.60234.20198

Сегнетоэлектрики в виде монокристаллов, тонких пленок и керамик широко применяются в приборах CBЧ, устройствах акустоэлектроники, приборах электронной памяти и др. [1,2]. Одним из наиболее востребованных в практическом отношении сегнетоэлектриков является титанат бария (BaTiO<sub>3</sub>) и твердые растворы на его основе. Выше температуры Кюри  $T_C \approx 120 \,^{\circ}\text{C}$ BaTiO<sub>3</sub> имеет простую кубическую решетку  $Pm\bar{3}m$ . Ниже  $T_C$  он переходит в сегнетоэлектрическую фазу с тетрагональной кристаллической решеткой (P4mm). С дальнейшим понижением температуры реализуется переход в орторомбическую фазу Amm2 при температуре  $T_1 \approx 5 \,^{\circ}$ С, а затем (около  $-90 \,^{\circ}$ С) в ромбоэдрическую фазу R3m [1].

Физические свойства ВаТіО<sub>3</sub> зависят от технологии его получения. В частности, объемный титанат бария является диамагнетиком, но в нанокристаллическом состоянии он приобретает свойства слабого ферромагнетика [3–5]. Магнетизм ультрадисперсного ВаТіО<sub>3</sub> связан с кислородными вакансиями ( $V_0$ ), локализованными преимущественно на поверхности частиц. Они формируют комплексы Ti<sup>3+</sup>– $V_0$  и Ti<sup>3+</sup>–O в частицах ВаТіО<sub>3</sub>, в которых ионы Ti<sup>3+</sup> обладают нецелочисленным спином в состоянии  $d^1$  [3–5].

Заметное влияние на физические свойства материалов оказывает силовое воздействие в сочетании со сдвиговой деформацией (СВСД) [6,7]. Эффект связан с формированием в образце механических напряжений, релаксация которых приводит к различного рода дефектам: дислокациям, пластической деформации и распаду частиц вещества на множество более мелких.

Цель настоящей работы — экспериментально исследовать влияние сдвиговых деформаций на структуру, диэлектрические и магнитные свойства титаната бария. Порошок BaTiO<sub>3</sub> был синтезирован по керамической технологии. В качестве исходных компонентов использовали BaCO<sub>3</sub> и TiO<sub>2</sub> марки чда. Твердофазный синтез осуществляли на воздухе при температуре  $1300 \degree C$  в течение 2 h. Синтезированный материал подвергли предварительному четырехчасовому помолу в планетарной мельнице "DECO-PBM-V-OUL" с использованием стаканов и шаров из оксида циркония.

Часть полученного порошка подвергли дополнительной механической обработке, сочетающей силовое воздействие со сдвиговой деформацией, с использованием наковален Бриджмена из карбида вольфрама под давлением 175 MPa в течение 40 min.

Рентгенофазный анализ, проведенный при комнатной температуре с помощью рентгеновского дифрактометра D2 Phaser (Bruker, Germany) (излучение Cu $K_{\alpha}$ ,  $K_{\alpha 1} = 1.54060$  Å,  $K_{\alpha 2} = 1.54443$  Å, шаг  $\Delta 2\theta = 0.01^{\circ}$ , время сбора данных  $\tau = 0.1$  s), показал, что полученный материал обладает тетрагональной кристаллической решеткой (*P4mm*). Размер области когерентного рассеяния, определенный по методу Вильямсона–Холла, для исходного и подвергшегося СВСД образцов составил около 27 nm, параметры тетрагональной ячейки  $a \approx 3.995$  Å и  $c \approx 4.027$  Å.

Измерения диэлектрической проницаемости ( $\varepsilon$ ) и тангенса угла диэлектрических потерь (tg $\delta$ ) проводили на образцах в форме диска диаметром 10 mm и толщиной около 0.7 mm в интервале температур 20–500 °C на частоте 10 kHz.

Для измерений зависимости намагниченности *M* от напряженности магнитного поля *H* около 6 mg порошка BaTiO<sub>3</sub> насыпали на специальную пленку PARAFILM "M", заворачивали и формировали сферу (шарик). Шарик фиксировали в цилиндрической кюве-

те, которая привинчивалась к стержню вибрационного магнитометра LakeShore 7404. Чувствительность магнитометра составляла 0.1 µети, что позволяло уверенно принимать сигнал от образца.

Измерения проводили при комнатной температуре с использованием вибрационного магнитометра LakeShore 7404 в полях напряженностью до  $\pm 10$  kOe.

Кривые намагничивания M(H) для исследуемых материалов показаны на вставке к рис. 1. Зависимости M(H) можно представить как суперпозицию вкладов ферромагнитной и диамагнитной составляющих намагниченности. Петли M(H), полученные после выделения диамагнитного вклада, для всех исследованных образцов изображены на рис. 1. Они имеют типичную форму петель ферромагнитного гистерезиса, наблюдавшихся ранее для наночастиц титаната бария [3–5].

Полученные петли магнитного гистерезиса свидетельствуют о наличии как в исходном, так и в подвергшемся СВСД образце дефектов, содержащих комплексы  $Ti^{3+}-V_O$  и  $Ti^{3+}-O$ .

Коэрцитивная сила  $(H_c)$  для обоих образцов практически одинакова (см. рис. 1 и таблицу). Однако намагниченность насыщения  $(M_s)$  и остаточная намагниченность  $(M_r)$  титаната бария, подвергшегося СВСД, вдвое больше, чем у исходного порошка, что указывает на более высокую концентрацию в нем "магнитных ионов", при том что по данным рентгенодифракционного эксперимента средние размеры области когерентного рассеяния приблизительно совпадают. Это позволяет предположить, что в ходе СВСД комплексы типа



**Рис. 1.** Зависимости M(H) для исходного (1) и подвергшегося СВСД (2) порошка ВаТіО<sub>3</sub> после вычитания диамагнитного отклика. На вставке — полные зависимости M(H).

Параметры петель магнитного гистерезиса BaTiO<sub>3</sub>

Образец	$H_c$ , Oe	$M_r$ , emu/mol	$M_s$ , emu/mol
Исходный	127.2	0.0032	0.019
Подвергшийся СВСД	122.2	0.006	0.036

 $Ti^{3+}-V_O$  и  $Ti^{3+}-O$  формируются не только на поверхностях нанокристаллитов, но и внутри них, вероятно на дислокациях [5], существенное возрастание плотности которых происходит при СВСД-обработке [6].

Для проведения диэлектрических исследований было проведено спекание при температурах 1000 и 1300 °С порошковых материалов в форме диска диаметром 10 mm и толщиной 0.7 mm. Измерения диэлектрической проницаемости ( $\varepsilon$ ) осуществляли с помощью измерителя иммитанса E7-20 на частоте 10 kHz в режиме нагрева в интервале 20–500 °С.

Зависимости  $\varepsilon(T)$  имеют характерный для ВаТіО<sub>3</sub> вид (рис. 2). С понижением температуры наблюдается быстрый рост диэлектрической проницаемости, которая достигает максимума в окрестностях  $T_C$ , ниже которой в некотором интервале температур происходит спад  $\varepsilon$ вплоть до температур, близких к  $T_1 \approx 5$  °C.

Кривые  $\varepsilon(T)$ , полученные для образцов, спеченных при температуре 1000 °С, в значительной степени совпадают. Оба образца характеризуются относительно невысокой диэлектрической проницаемостью и слабовыраженным, размытым максимумом  $\varepsilon$  в окрестностях  $T_C \approx 133$  °С. Сравнительно низкую диэлектрическую



Рис. 2. Температурные зависимости  $\varepsilon$  для исходного (1, 1') и подвергшегося СВСД (2, 2') керамических образцов ВаТіО<sub>3</sub>, спеченных при температурах 1000 (1, 2) и 1300°С (1', 2'). На вставке — температурные зависимости tg $\delta$  для исходного (3) и подвергшегося СВСД (4) образцов, спеченных при температуре 1300°С.

проницаемость обоих образцов естественно связать с их значительной пористостью, а также высокой степенью дефектности и остаточными механическими напряжениями. На наличие последних указывают существенно размытые максимумы  $\varepsilon$  вблизи  $T_C$ , которые несколько смещены в сторону высоких температур по сравнению с наблюдаемыми для обычной керамики BaTiO<sub>3</sub> [1]. Причины такого смещения пока не выяснены, однако можно предположить, что оно может быть вызвано остаточными упругими напряжениями подобно тому, как это происходит в эпитаксиальных сегнетоэлектрических пленках [8].

В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что отжиг образцов при 1300 °С приводит к понижению температуры Кюри до  $\sim$  127 °С. Наряду с этим происходит существенное возрастание  $\varepsilon$  обоих материалов и формирование четкого пика  $\varepsilon$  вблизи  $T_C$ .

Диэлектрическая проницаемость образца, подвергшегося СВСД, после отжига при температуре 1300 °С заметно меньше, чем у исходного (ср. кривые *I'* и *2'* на рис. 2), а диэлектрические потери в сегнетоэлектрической фазе, где они преимущественно обусловлены взаимодействием доменных границ с дефектами решетки [9], наоборот, больше (вставка к рис. 2). Это указывает на то, что образец, подвергшийся СВСД, содержит более высокую концентрацию дефектов, которые сохраняются даже после высокотемпературного термического отжига.

По-видимому, такими дефектами являются дислокации, которые могут быть ответственны за увеличение намагниченности насыщения в образце, подвергшемся СВСД.

Таким образом, эксперимент показал, что как исходный порошок титаната бария, так и порошок, подвергшиеся СВСД-обработке, обладают слабым магнетизмом при комнатной температуре. СВСД привело к заметному увеличению намагниченности насыщения. С учетом характера воздействия СВСД сделано предположение, что повышение  $M_s$  частиц ВаТіО<sub>3</sub> связано с ростом в них плотности дислокаций, в которых из-за нарушения химических связей можно ожидать появления ионов Ti<sup>3+</sup>, обладающих нескомпенсированным магнитным моментом.

Установлено, что дефекты решетки, вызванные интенсивной сдвиговой деформацией, обладают высокой устойчивостью к высокотемпературному термическому отжигу, что отражается в более слабом диэлектрическом отклике обработанного образца в сравнении с исходным после их термического отжига при температуре 1300 °С.

## Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 24-22-20054) и Программы стратегического академического лидерства Южного федерального университета ("Приоритет-2030").

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- М. Лайнс, А. Гласс, Сегнетоэлектрики и родственные им материалы (Мир, М., 1981). [М.Е. Lines, А.М. Glass, Principles and application of ferroelectrics and related materials (Clarendon Press, Oxford, 1977).].
- [2] К.А. Воротилов, В.М. Мухортов, А.С. Сигов, Интегрированные сегнетоэлектрические устройства (Энергоатомиздат, М., 2011).
- [3] K. Siemek, A. Olejniczak, L.N. Korotkov, P. Konieczny, A.V. Belushkin, Appl. Surf. Sci., 578, 151807 (2022). DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.151807
- [4] T.L. Phan, P. Zhang, D.S. Yang, D. Thanh, D.A. Tuan, S.C. Yu, C. Natio, J. Appl. Phys., 113, 17E305 (2013).
   DOI: 10.1063/1.4799473
- [5] S.G. Bahoosh, S. Trimper, J.M. Wesselinowa, Phys. Status Solidi RRL, 5 (10-11), 382 (2011). DOI: 10.1002/pssr.201105419
- [6] K.G. Abdulvakhidov, M.A. Sirota, A.P. Budnyk, T.A. Lastovina, B.K. Abdulvakhidov, S.A. Sadykov, P.S. Plyaka, A.V. Soldatov, J. Phys.: Condens. Matter, **31**, 135402 (2019). DOI: 10.1088/1361-648X/aafebe
- [7] К.Г. Абдулвахидов, М.А. Витченко, И.В. Мардасова, Э.Н. Ошаева, ЖТФ, **78** (5), 131 (2008). [К.G. Abdulvakhidov, М.А. Vitchenko, I.V. Mardasova, E.N. Oshaeva, Tech. Phys., **53** (5), 661 (2008). DOI: 10.1134/S1063784208050228].
- [8] K. Komatsu, I. Suzuki, T. Aoki, Y. Hamasaki, S. Yasui, M. Itoh, T. Taniyama, Appl. Phys. Lett., **117**, 072902 (2020).
   DOI: 10.1063/5.0013484
- [9] S.A. Gridnev, Ferroelectrics, 266, 171 (2002).
  DOI: 10.1080/00150190211452